

P R E S S E M I T T E I L U N G

DAS NEUE SPECTRO XEPOS SETZT NEUE MASSTÄBE IN DER ED-RFA- ELEMENTANALYSE

Kleve, 19. Januar 2016 – SPECTRO Analytical Instruments hat heute die Einführung der neuen Generation des energie dispersiven Röntgenfluoreszenz-Spektrometers (ED-RFA) SPECTRO XEPOS bekanntgegeben. Die neue Modellreihe stellt einen Quantensprung in der ED-RFA-Technologie dar und ermöglicht bahnbrechende Fortschritte bei der Multi-Element-Analyse unterschiedlicher Konzentrationen – bis hin zu Spurenelementen.

Durch neue Entwicklungen im Bereich Anregung und Detektortechnologie bietet das SPECTRO XEPOS eine außergewöhnliche Messempfindlichkeit und extrem niedrige Nachweisgrenzen – mit bemerkenswerter Verbesserung von Präzision und Genauigkeit. Insbesondere bei anspruchsvollen Aufgaben spielt das SPECTRO XEPOS seine Stärken aus – egal ob es dabei um schnelle Übersichtsanalysen von Umwelt- und Abfallproben oder um anspruchsvolle Anwendungen in Forschung, Wissenschaft und Geologie geht. Es ermöglicht präzise Qualitätskontrollen für eine Fülle von Anwendungen, beispielsweise in den Bereichen Petrochemie, Chemie, Klinker/Zement/Schlacke, Kosmetika, Nahrungs- und Futtermittel, Pharmazie und vielen mehr.

Das neue SPECTRO XEPOS bietet eine Reihe von Vorteilen:

- **Spektakuläre Messempfindlichkeit:** Innovationen im Bereich der adaptiven Anregung, der Röntgenröhre und der Detektortechnologie haben die Messempfindlichkeit deutlich verbessert – oftmals um den Faktor 10 oder mehr.

SPECTRO Analytical Instruments GmbH, Sitz der Gesellschaft: Kleve,
Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRB 1876, Geschäftsführer: Manfred A. Bergsch,
USt-ID-Nr. DE 196424280, WEEE-Reg.-Nr. DE18444053

Bankverbindung / Bank Details:
Commerzbank AG, Filiale Kleve, IBAN DE96324400230810676700, BIC COBA DE FF,
Konto 810 676 700 (BLZ 324 400 23)



Diese außergewöhnliche Empfindlichkeit ist die Basis für hohe Präzision und deutlich niedrigere Nachweisgrenzen. Auf diese Weise erhält der Anwender eine schnelle und genaue Analyse eines breiten Elementbereichs, von Natrium bis Uran.

Zusammen mit dem leistungsfähigen Detektor, dem neuen Röhrendesign, der hohen Messempfindlichkeit und dem niedrigen Untergrund ermöglicht die proprietäre adaptive Anregungstechnologie außergewöhnlich niedrige Nachweisgrenzen für eine große Bandbreite an Elementen.

- **Unvergleichliche Präzision:** Anders als die meisten anderen ED-RFA-Geräte verfolgt das SPECTRO XEPOS das Prinzip, die Röntgenröhre zwischen den Messungen in Betrieb zu lassen, um zu vermeiden, dass sich Schwankungen durch Ein- und Ausschalten auf die Messung auswirken. Dies ermöglicht eine exzellente Langzeitstabilität und eine außergewöhnlich hohe Präzision – und zwar bis zu dreimal besser als zuvor. Zusammen mit der höheren Messempfindlichkeit ist dies die Grundlage für eine deutlich höhere Genauigkeit der Analyse, von Spurenelementen bis hin zu höheren Konzentrationen.
- **Schnellere Messungen:** Für einige Anwender hat Geschwindigkeit eine höhere Priorität als äußerste Präzision. Sie haben mit dem SPECTRO XEPOS nun die Wahl: Sie erhalten ein Gerät, das ihnen wesentlich kürzere Messzeiten ermöglicht – bei einer Präzision, die immer noch mit der eines herkömmlichen ED-RFA-Spektrometers vergleichbar ist. Durch die hohe Geschwindigkeit des Systems sind Analysen der meisten Proben innerhalb weniger Minuten abgeschlossen.

Die vollkommen überarbeitete Analysesoftware bietet Komfort und Funktionalität, während das einzigartige, neue TurboQuant II Analytikpaket schnell und präzise unbekannte Flüssigkeiten, Pulver und Feststoffe aller Art analysiert. Auch die Kosten sprechen für das SPECTRO XEPOS: Im Vergleich zu einem wellenlängendispersiven

Röntgenfluoreszenzgerät (WD-RFA) ist es deutlich kostengünstiger und erbringt in vielen Anwendungsbereichen WD-Leistung zum ED-Preis.

Der optionale AMECARE M2M (Maschine-zu-Maschine) Support erweitert die Selbstdiagnose-Funktionen des Geräts um proaktive Warnsignale. Darüber hinaus besteht eine direkte Verbindung mit einem Service-Experten von SPECTRO.

Die neue Modellreihe des SPECTRO XEPOS ED-XRF-Spektrometers ist ab sofort über SPECTRO Analytical Instruments erhältlich. Dabei bieten vier fortschrittliche Modellvarianten die Möglichkeit, Prioritäten zu setzen: Maximale Messgeschwindigkeit, höchstmögliche Präzision oder eine Optimierung für ganz bestimmte Gruppen von Zielelementen in vorgegebenen Probenmatrices.

Weitere Informationen finden Sie auf <http://www.spectro.de/xepos> oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: spectro.info@ametek.com. SPECTRO Analytical Instruments ist ein weltweit führender Anbieter von Analysegeräten auf den Gebieten der Röntgenfluoreszenz-Spektrometrie, der Optischen Emissions-Spektrometrie mit Bogen- und Funkenanregung, der Optischen Emissions-Spektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma sowie der ICP-Massenspektrometrie für die Elementanalytik in Industrie, Laborpraxis und Wissenschaft.

Über SPECTRO:

SPECTRO ist einer der weltweit führenden Anbieter von Analysegeräten auf dem Gebiet der Optischen Emissions- und Röntgenfluoreszenz-Spektrometrie. Als Unternehmensbereich der AMETEK Materials Analysis Division produziert SPECTRO zukunftsweisende Geräte, entwickelt für die verschiedenartigsten Aufgabenstellungen die besten Lösungen und stellt eine hervorragende Kundenbetreuung sicher. SPECTRO-Produkte sind bekannt für ihre einzigartige technische Leistungsfähigkeit mit messbarem Nutzen für den Kunden. Von der Gründung 1979 bis heute wurden weltweit bereits mehr als 40.000 Analysegeräte an Kunden geliefert.

AMETEK, Inc. ist ein führender, weltweit aktiver Hersteller von elektronischen und elektromechanischen Produkten mit über 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an nahezu 150 Produktions-, Vertriebs- und Servicestandorten in den Vereinigten Staaten und über 30 anderen Ländern.

###

Hinweis an die Redaktionen:

- **Pressekontakt:**
 - Deutschland: Tom Milner, Tel: +49-2821-8920
 - USA: Don Goncalves, Tel: +1-781-793-9380 oder dgoncalves@tizinc.com
- **Download der hochauflösenden Pressebilder:** <http://www.spectro.de/ueberuns/presse/pressebilder>